



100-X Micron Star

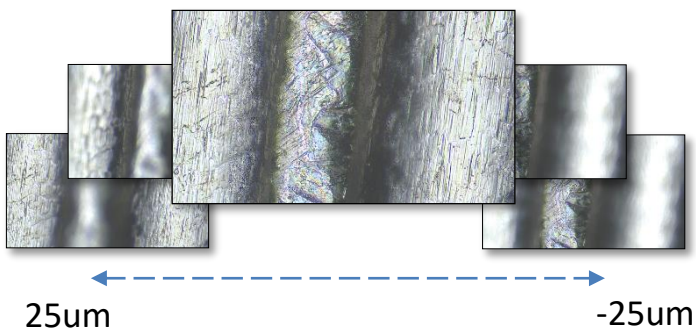


同轴光束系统

- 易观察景深迭图与量测
- 便利式缝合大尺寸样品
- 无需携带计算机操作量测

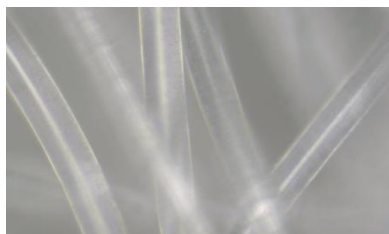
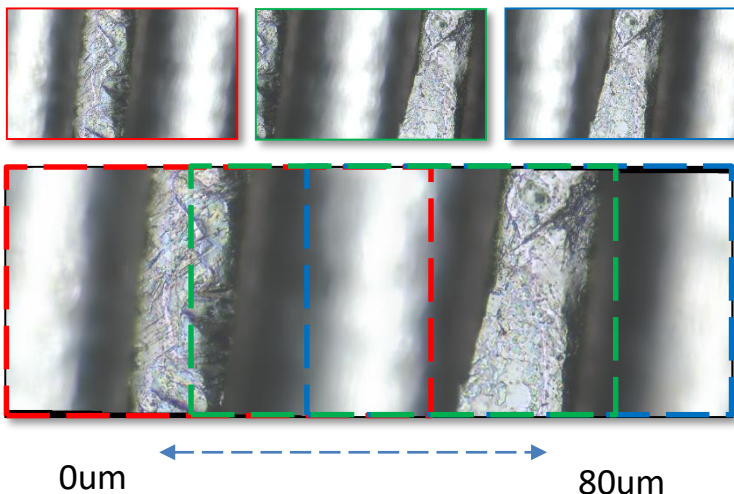


● 景深迭图及景深量测(z)

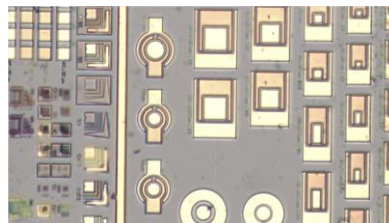


● 图像缝合及距离量测(x,y)

● 实际样品拍摄应用



明视野
纤维样品



电子电路
检测系统